

Cartographie Raman sur composant premiers résultats et perspectives pour l'analyse de défauts et de construction



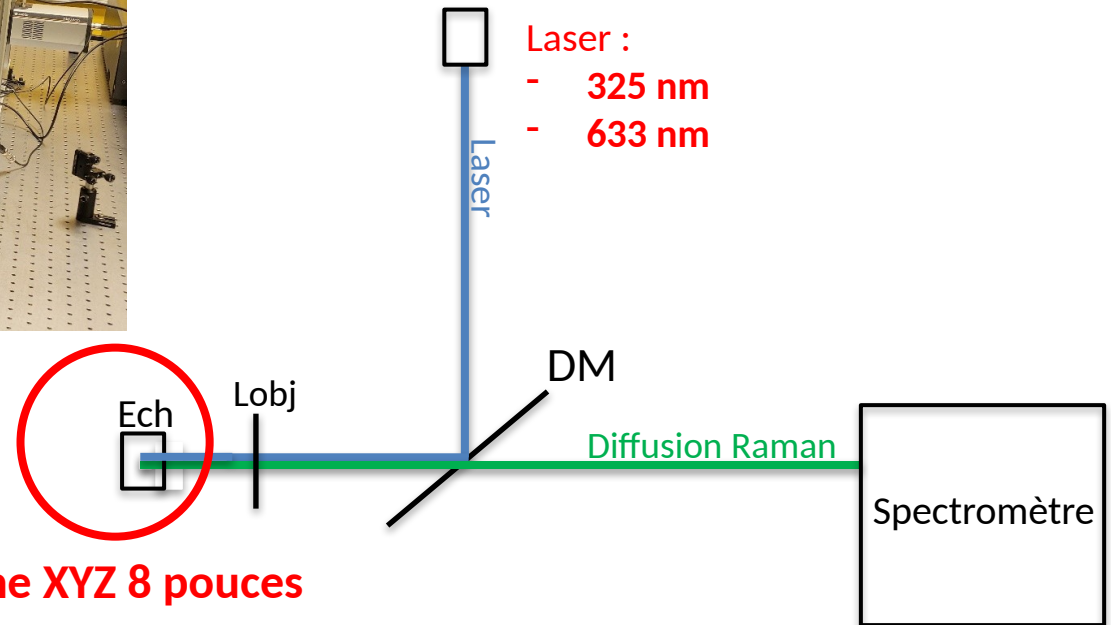
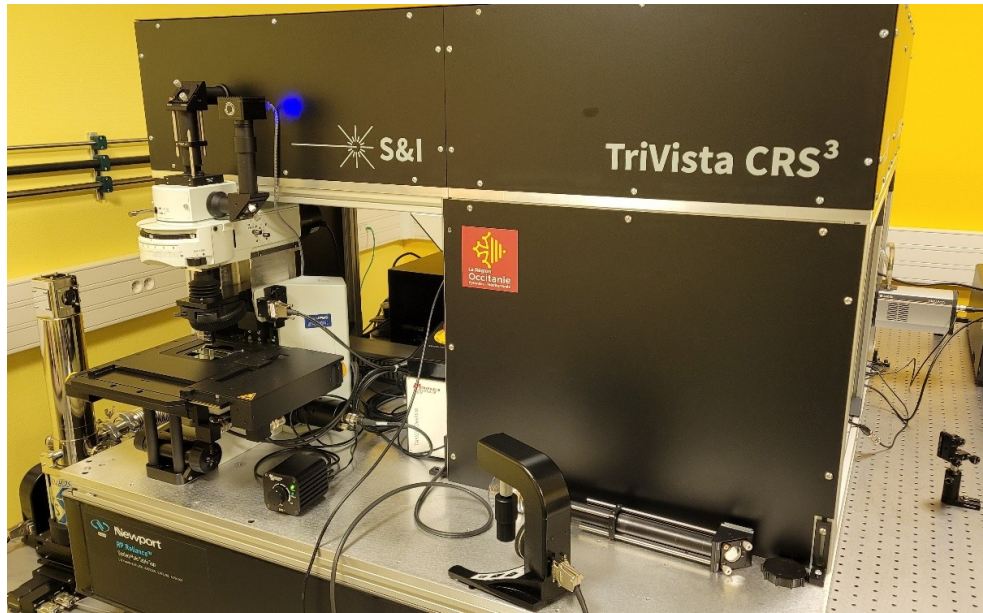
David Trémouilles

COS PROOF

30 Avril 2024

- > Cartographie Raman
- > Localisation de défauts
- > Analyse de construction

Banc de caractérisation Raman/Photolum

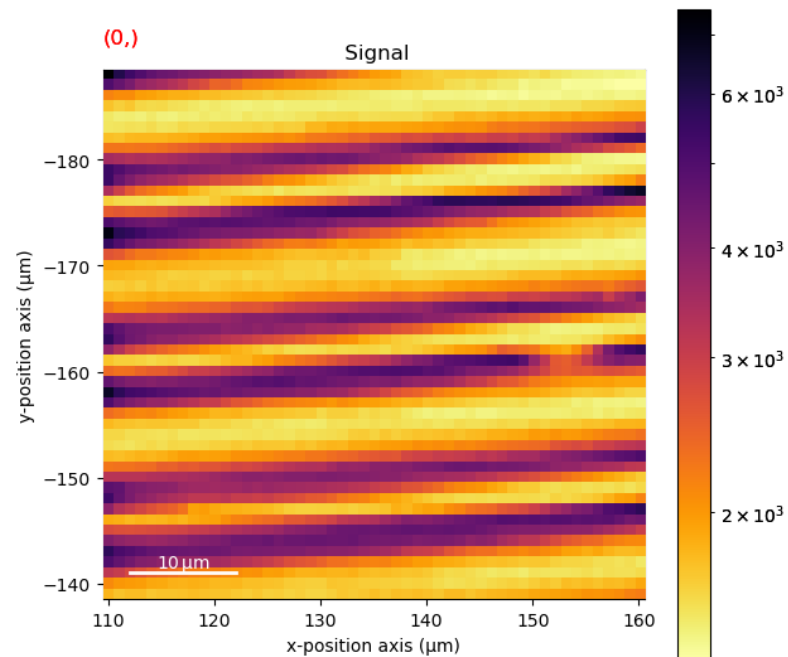
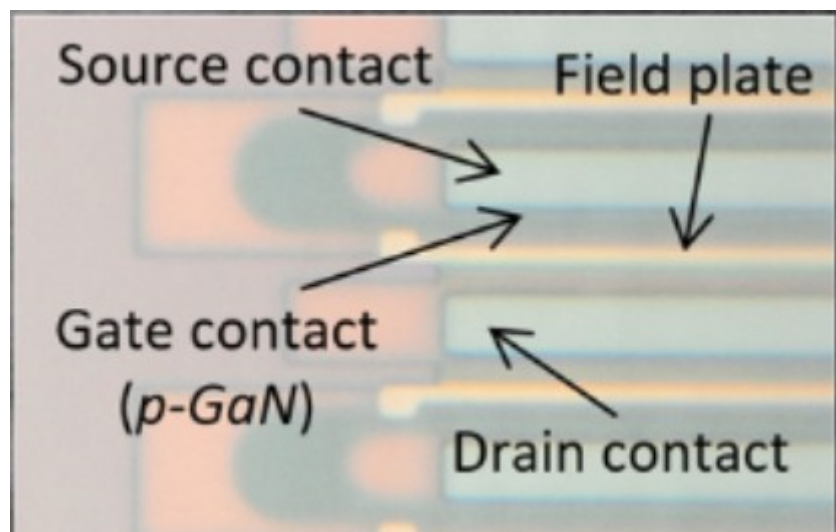
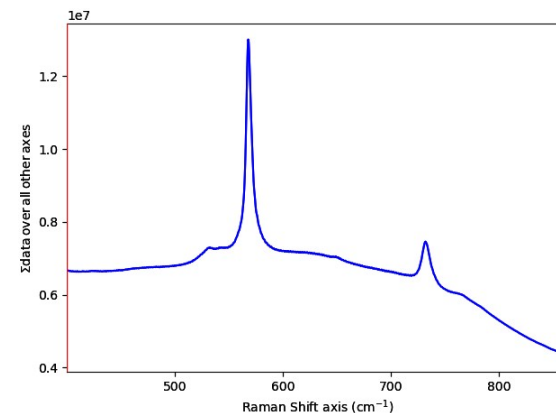
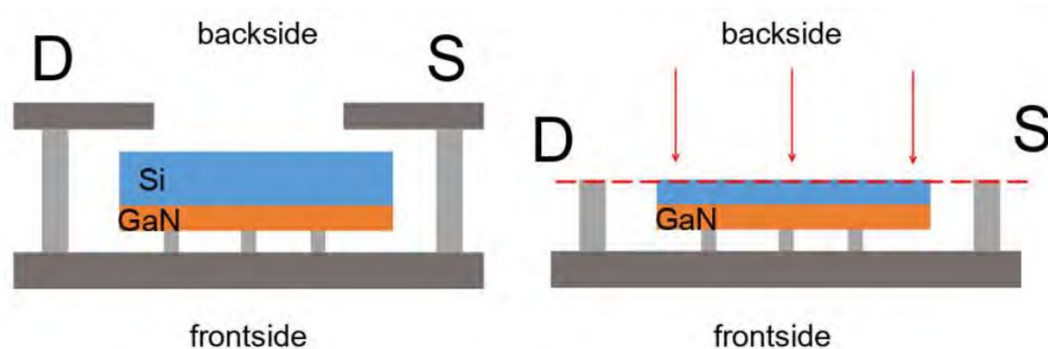


- Raman visible - Si, SiC, GaN, AlGaIn, Diamant et AlN
- Raman UV - Analyse en surface (- de 100 nm)
- μ -Raman \rightarrow Spot $< 1 \mu\text{m}$
- Platine XYZ 8 pouces \rightarrow Résolution de déplacement $< 1 \mu\text{m}$

- > Cartographie Raman
- > **Localisation de défauts**
- > Analyse de construction

Localisation Raman face arrière

Préparation de l'échantillon



- > Cartographie Raman
- > Localisation de défauts
- > **Analyse de construction**

Analyse face avant

Préparation de l'échantillon

